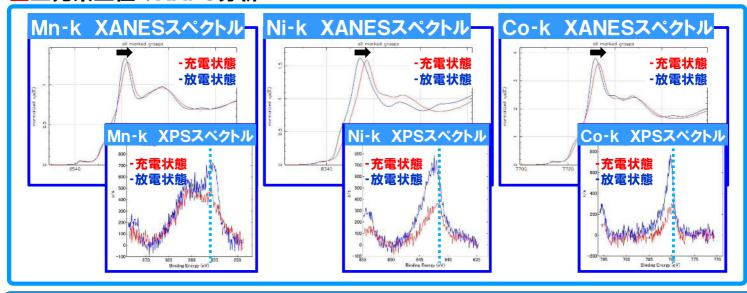


NEW

最先端分析(放射光XAFS, Cs-STEM)

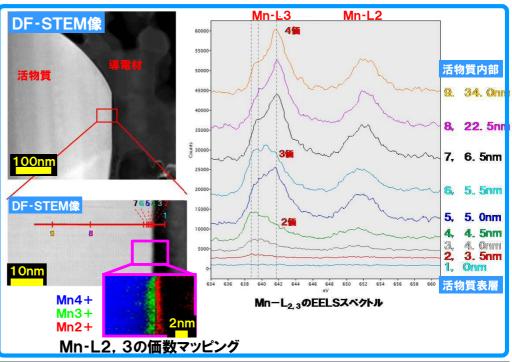
大型放射光施設を利用した分析が可能。 収差補正STEMより原子レベルの観察および分析が可能。 どちらの分析も大気非暴露分析も可能。

■三元系正極のXAFS分析



- ・XPSでは充放電に伴うMn, Ni, Coの状態変化を捉える事が出来なかったが, XANESスペクトルでは 充電に伴う状態変化が確認された。(ピークが高エネルギー側にシフト⇒価数の増加を確認)
- **XAFSは金属の僅かな構造変化を捉える事が出来ます。**
- ■三元系正極のCs-STEM/EELS分析





- ・EELSカラムマッピングによって、Ni、Mn、Co及び酸素から成る層状岩塩構造を確認した。
- ・高分解能EELS分析により、活物質表層~内部におけるMnの価数変化(2価~4価)を確認した。
- **Cs-STEMは原子の直接観察(散乱電子の格子像撮影)や高分解能EELSを取得出来ます。**